



IRANIAN SOCIETY of
CRYSTALLOGRAPHY
and MINERALOGY

Vol. 11, No. 1, 1382/2003 Spring & Summer

IRANIAN JOURNAL of
CRYSTALLOGRAPHY
and MINERALOGY

Determination of oxidation states of sulfur and magnesium with x-ray spectrometry

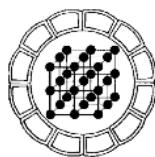
S.B. Dilmaghani, H. Rohbakhsh

X-Ray Lab. Faculty of Physics, Tabriz University, Tabriz, Iran
E-mail: saeidbaradaran@hotmail.com

(received: 23/1/2003, received in revised form: 30/4/2003)

Abstract: The energies of the emission spectral lines originating from vacancies in deep atomic shells change if the elements are in different oxidation states. These changes of energies cause small shifts in spectral lines. For Sulfur and Magnesium, these shifts are shown in this work, and also the influence that they may have on the calibration of wavelength-dispersive spectrometers and in consequence, on quantitative and qualitative analysis by XRF. Also, these changes prove to be useful in identifying oxidation states and in some cases phases in different oxidation states.

Keywords: *Chemical Shift, X-Ray Spectrometry, Sulfur, Magnesium.*



تعیین حالت اکسایش عنصر گوگرد و منیزیوم با طیف‌سننجی نشری پرتو X

سعید برادران دیلمقانی، هادی روح‌بخش

دانشگاه تبریز، دانشکده‌ی فیزیک، آزمایشگاه پرتو X

پست الکترونیکی: saeidbaradaran@hotmail.com

(دریافت مقاله ۱۳۸۱/۱۱/۳ ، دریافت نسخه نهایی ۱۳۸۲/۲/۱۰)

چکیده: تغییر عدد اکسایش یک عنصر سبب تغییراتی در انرژی خطوط طیفی حاصل از گذارهای الکترونی بین لایه‌های درونی اتم می‌شود. این تغییرات انرژی موجب جابه‌جایی جزئی در مکان خطوط طیفی خواهد شد که فقط با طیف‌سنجهای حساس مجهز به کامپیوتر، قابل آشکارسازی است. در این مقاله تغییرات یاد شده در دو عنصر گوگرد و منیزیوم مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، و اثر احتمالی آنها بر درجه‌بندی طیف‌سنجهای پاشنده طول موج، و در نتیجه بر تحلیلهای کمی و کیفی به روش XRF نیز بررسی شده‌اند. از جمله معلوم شده است که در مواردی، این تغییرات می‌توانند در تعیین حالت اکسایش و پیوند شیمیایی عنصر در نمونه مورد بررسی، مفید باشند.

واژه‌های کلیدی: جابه‌جایی شیمیایی، طیف‌سننجی پرتو ایکس، گوگرد، منیزیوم.

مقدمه

از آنجا که گذارهای منجر به تولید پرتو X به الکترونها لایه‌های مغزی وابسته‌اند نه الکترونها ظرفیت یارسانش، بنابراین در حالت کلی انرژی فوتون آزاد شده، به ظرفیت یا حالت پیوندی اتم مورد نظر بستگی ندارد. اما در شرایط خاص، تغییرات بسیار کوچکی در انرژی فوتون گسیل شده مشاهده می‌شوند که رهیافتی است به آگاهیهای بالرزش در مورد ظرفیت و حالت‌های پیوندی عنصر مورد نظر [۱]. به عنوان مثال طول موج گسیلی $K\beta_{1,3}$ در اتم آلمینیوم حاصل گذار $K \rightarrow 3p$ است که در آن تراز ظرفیت $3p$ نیمه پر است، و به همین دلیل طول موج وابسته به آن باشد بسیار کم و به شکل یک قله پهن در طیف آلمینیوم مشاهده می‌شود. الگو و مکان این قله به شدت به پیوند شیمیایی اتم آلمینیوم حساس، و شدت آن در اتمهای سنگین بیشتر است. در این حالت طول موج مورد نظر، حاصل گذار از تراز ظرفیت نیست. بنابراین شکل یا مکان آن چندان تحت تأثیر پیوند شیمیایی اتم مربوطه نخواهد بود [۲]. در حالت کلی به هر تغییری که در اثر پیوند شیمیایی یک اتم با اتمهای دیگر در طیف سرشناسی XRF، طیف AES، یا طیف XPS یک عنصر مشاهده می‌شود، اثر شیمیایی گفته می‌شود. تغییرات حاصل از اثر شیمیایی در خطوط طیفی سری K عناصر سبک و نیز در خطوط طیفی سری L و M عناصر سنگین را می‌توان با طیف سنجهای دقیق پرتو X آشکار و ثبت کرد.

اولین بار بائون (Baun) اثر شیمیایی در طیف سرشناسی پرتو X عناصر را به چهار گروه زیر دسته‌بندی کرد [۳]:

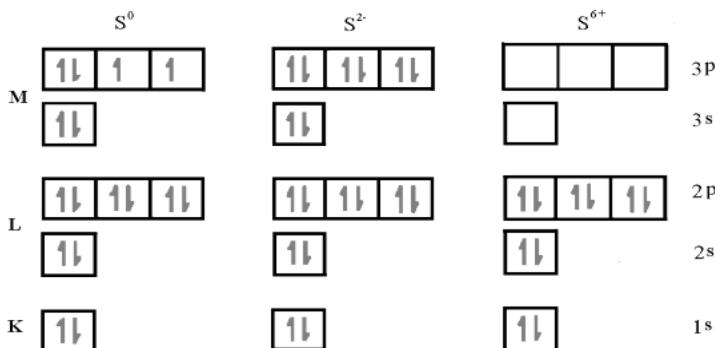
- (۱) انتقال طول موج ها (جابه‌جایی شیمیایی)،
- (۲) حضور یا عدم حضور خطوط پیرو،
- (۳) تغییر پهنانی خطوط طیفی،
- (۴) تغییر شدت طول موجها.

در این پژوهش، نقش عدد اکسایش در جابه‌جایی شیمیایی گذارهای K_α و K_β عناصر گوگرد و منیزیوم بررسی شده است.

معرفی دستگاه و مواد مورد استفاده

طیف سنج دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز (زمینس مدل SRS200) مجهز به نرم افزار XRD است که علاوه بر رسم همزمان منحنی شدت بر حسب زاویه، منحنی های حاصل را با دقت بسیار خوبی پردازش و چاپ می کند [۴].

گوگرد ($Z = 16$) در طبیعت با حالت های اکسایش مختلفی یافت می شود. از این میان دو حالت S^{2-} و S^{6+} بیشترین اختلاف را دارند (در واقع بنابه تعریف عدد اکسایش، ظاهرآ حالت S^{2-} ، ۸ الکترون بیش از حالت S^{6+} دارد). بنابراین انتظار داریم بیشترین تفاوت را در گذارهای K_{β} و K_{α} این دو حالت مشاهده کنیم. البته تغییرات خط طیفی K_{β} به این دلیل که حاصل گذار از لایه ظرفیت است، بیشتر خواهد بود. بنابه تعریف حالت اکسایش، پیکربندی الکترونی را می توان در حالت های S^0 (atom آزاد)، S^{2-} (مثلاً در سولفید) و S^{6+} (مثلاً در سولفات) به ترتیبی که در شکل ۱ آمده است، نمایش داد.



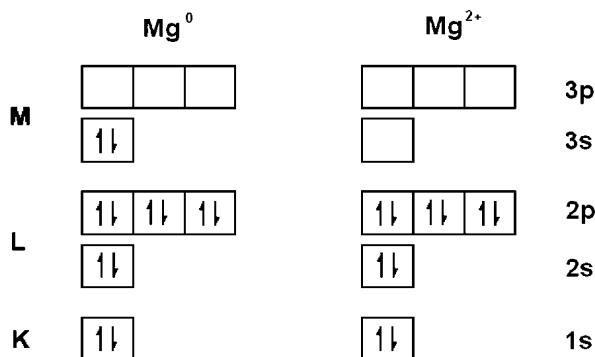
شکل ۱ پیکربندی الکترونی گوگرد در S^{6+} و S^{2-} و S^0 .

گوگرد به خاطر بهره فلورسانی نسبتاً بالایی که دارد به خوبی با این طیفسنج قابل آشکارسازی است. اما منیزیوم ($Z = 12$) به خاطر فلورسانی بسیار پایین، در ناحیه مرزی آشکارسازی این طیفسنج قرار داد. در این ناحیه دقت دستگاه به شدت افت می کند، به این دلیل که برای مشاهده طیف سرشتی منیزیوم ناچار باید شدت پروتو \times فرودی را افزایش داد که این خود موجب بالا رفتن تابش زمینه و کاهش دقت آشکارسازی می شود. در واقع بهتر است این عنصر به روش AES مطالعه شود.

منیزیوم در طبیعت فقط با دو حالت اکسایش $+2$ و 0 حضور دارد. پیکربندی الکترونی این دو حالت را در شکل ۲ می بینید. در اینجا چون اختلاف اعداد اکسایش چندان زیاد نیست، انتظار تغییرات خیلی زیادی در طیف سرشتی این عنصر نداریم.

روش تحقیق

در این بررسی برای گوگرد⁶⁺ و منیزیوم²⁺ از سولفات منیزیوم ($Mg SO_4$) ، برای گوگرد⁻² از سولفید آهن (FeS) ، برای گوگرد⁰ از پودر گوگرد₈S، و برای Mg^0 از پودر منیزیوم فلزی استفاده شده است.



شکل ۲ پیکربندی الکترونی منیزیم در Mg^0 و Mg^{2+} .

به منظور حذف خطاهای احتمالی ناشی از تغییر دما، همه آزمایشها را در دمای $18^\circ C$ انجام داده‌ایم.

برای مشاهده خطوط K_α و K_β گوگرد، بلور آنالیزور PET (2d = 0.875 nm) و برای K_α منیزیوم، از بلور آنالیزور KAP (2d = 2.662 nm) استفاده شد. چون شدت پرتوهای گسیلی، مستقل از انرژی آنهاست، اختلاف پتانسیل و شدت جریان لامپ پرتو x فرودی را در هر آزمایش به گونه‌ای تنظیم کردہایم که شدت یک طول موج خاص در حالت‌های اکسایش مختلف، تاحدوی مرجع مقایسه باشد.

کامپیوتر طیف سنج XRF مورد استفاده در این پژوهش، نمودار شدت را به روش پراش سنجی بر حسب 2θ رسم می‌کند. در اینجا برای محاسبه انرژی یک خط طیفی، نخست مکان دقیق قله آن خط را بر حسب 2θ و به روش نیم پهنه‌ای بیشینه به دست آورده‌یم، و سپس با استفاده از رابطه برآگ، یعنی:

$$2d \sin\theta = n\lambda$$

و با معلوم بودن فاصله صفحات بلور آنالیزور، طول موج متناظر با این زاویه را محاسبه کردیم. در آخرین مرحله با استفاده از رابطه:

$$E(\text{KeV}) = \frac{1.23964}{\lambda(\text{nm})} \cong \frac{1.24}{\lambda(\text{nm})}$$

مقدار انرژی این گذار را به دست آورده‌یم، و خطای محاسبات را از رابطه:

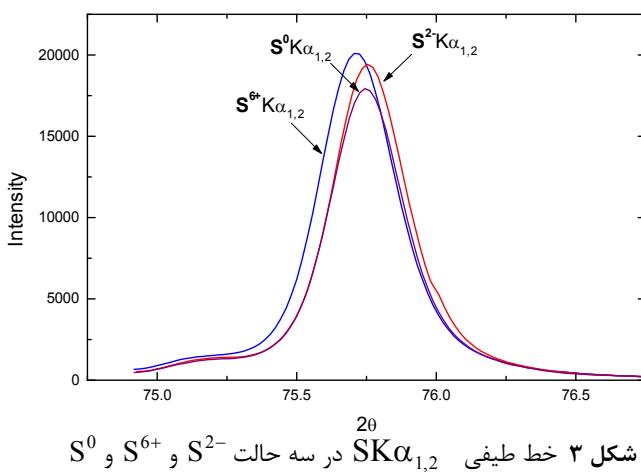
$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \cot(\theta)\Delta\theta$$

محاسبه کردیم [۵].

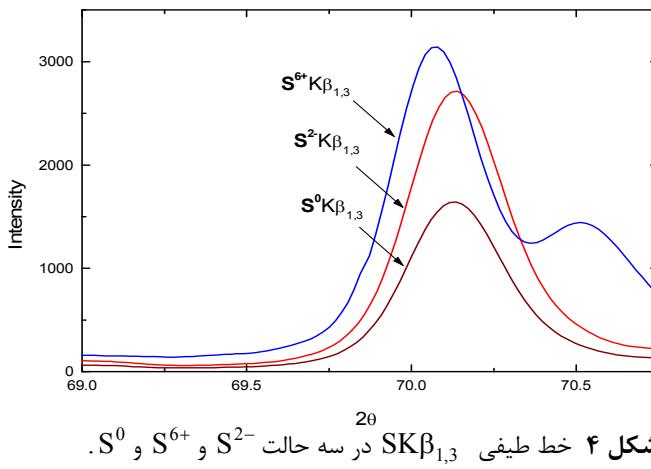
بحث و برداشت

نتایج عددی حاصل از آزمایش‌ها در جدول ۱ فهرست شده‌اند. مقادیر خطا را نیز در پرانتز قید کردیم. این مقادیر را می‌توان با داده‌های مشابه موجود در مراجع [۱] و [۲] مقایسه کرد.

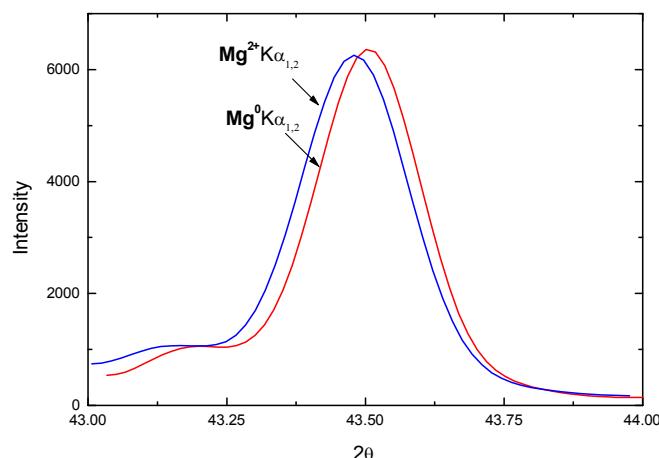
در شکل ۳ خط طیفی S^{6+} و در شکل ۴ خط طیفی S^{2-} در سه حالت S^{2-} و S^0 و S^{6+} در یک نمودار رسم شده‌اند تا انتقال شیمیایی قبل مشاهده باشد. به طور مشابه، خط طیفی $Mg - K\alpha_{1,2}$ در شکل ۵، و خط طیفی $Mg - K\beta_{1,3}$ در شکل ۶ در دو حالت Mg^0 و Mg^{2+} مقایسه شده‌اند.



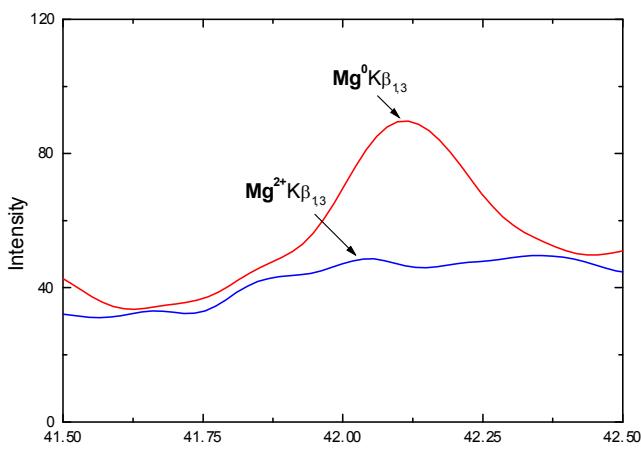
شکل ۳ خط طیفی S^{6+} و S^0 و S^{2-} در سه حالت S^{2-} و S^0 و S^{6+}



شکل ۴ خط طیفی S^{6+} و S^0 و S^{2-} در سه حالت S^{2-} و S^0 و S^{6+}



شکل ۵ خط طیفی Mg^{2+} و Mg^0 در دو حالت $MgK\alpha_{1,2}$



شکل ۶ خط طیفی Mg^{2+} و Mg^0 در دو حالت $MgK\beta_{1,3}$

جدول ۱ نتایج حاصل از مشاهدات تجربی.

حالت اکسایش	$E^{\text{obs}} K\alpha_{1,2} (\text{eV})$	$E^{\text{obs}} K\beta_{1,3} (\text{eV})$
S^0	2307.2(± 0.5)	2465.7(± 0.6)
S^{2-}	2307.4(± 0.5)	2465.6(± 0.6)
S^{6+}	2308.6(± 0.5)	2467.3(± 0.6)
Mg^0	1255.9(± 0.6)	1297.3(± 0.6)
Mg^{2+}	1256.3(± 0.6)	1298.9(± 0.6)

چنانکه ملاحظه می‌شود، خطوط طیفی ویژه عناصر گوگرد و منیزیوم در حالت‌های اکسایش مختلف، انرژی‌های متفاوتی دارند. انتظار می‌رود این پدیده برای سایر عناصر سبک نیز رخ دهد. با استفاده از یک طیفسنج دقیق که قادر به آشکارسازی این اختلاف باشد، می‌توان حالت یا حالت‌های اکسایش موجود یک عنصر در نمونه‌های مورد بررسی را تشخیص داد. برای درجه‌بندی دستگاه در آنالیزهای کمی و کیفی باید حالت اکسایش عنصر مورد بررسی را در نظر گرفت.

باور عمومی بر این است که پیوند بین اتم منیزیوم و آنیون SO_4^{2-} در ملکول $MgSO_4$ از نوع پیوندهای تشدید یونی است. در مورد نوع پیوند کاملاً یونی، دو الکترون تراز ظرفیت اتم منیزیوم به کلی به آنیون SO_4^{2-} منتقل شده‌اند. در حالی که حضور خط طیفی $Mg - K\beta_{1,3}$ در شکل ۶ (هرچندبا شدت خیلی کم) گواهی است بر این که دو الکترون ظرفیت منیزیوم هنوز به طور کامل از قید این اتم رها نشده‌اند. درنتیجه این پیوند تا حدودی سرشت کووالانسی نیزدارد (پیوند تشدید اتم- یون). همچنین حضور این خط را می‌توان نتیجه گذار ممنوع از تراز $3s$ به تراز $1s$ دانست.

مراجع

- [1] Perino E., et.al, *Determination of oxidatin states of aluminium, silicon and sulfur.*, X-Ray Spectrom. **31** (2002) 115-119
- [2] Williams K.L., *An Introduction to X-Ray Spctrometry: X-Ray Fluorescence and Electron Microprobe Analysis*, Allen&Unwin Ltd (1987).
- [3] Baun W.L., *Electron Probe Microanalysis*, Academic Press, New York (1969).
- [۴] برادران دیلمقانی سعید، بالازاده بهار حسین، پرتوی ناصر، تحلیل کامپیوتری داده‌های پراش‌سنجدی و طیفسنجی پرتو ایکس. مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، شماره ۱ (۱۳۷۴) صفحه ۱۵ تا ۲۲.

[۵] روح بخش منادی اول هادی، محاسبه تغییر ترازهای الکترونی اتم‌های گوگرد و منیزیوم در حالت ترکیب و مخلوط به روش XRF، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز (۱۳۸۱).